实验题目: PN 结正向压降与温度特性的研究

实验目的: 1.了解 PN 结正向压降随温度变化的基本关系式。

- 2.在恒流供电条件下,测绘 PN 结正向压降随温度变化曲线,并由此确定其灵敏度和被测 PN 结材料的禁带宽度。
- 3.学习用 PN 结测温的方法。

实验原理: 理想PN结的正向电流I_F和压降V_F存在如下近似关系

$$I_F = Is \exp(\frac{qV_F}{kT}) \tag{1}$$

其中 q 为电子电荷; k 为波尔兹曼常数; T 为绝对温度; Is 为反向饱和电流,它是一个和 PN 结材料的禁带宽度以及温度等有关的系数,可以证明

$$Is = CT^r \exp\left[-\frac{qV_g(0)}{kT}\right] \tag{2}$$

其中C是与结面积、掺质浓度等有关的常数: r也是常数; $V_g(0)$ 为绝对零度时PN结材料的导带底和价带顶的电势差。

将(2)式代入(1)式,两边取对数可得

$$V_{F} = V_{g}(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{c}{I_{F}}\right) T - \frac{kT}{q} \ln T^{r} = V_{1} + V_{n1}$$
(3)

其中

$$V_{1} = V_{g}(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{c}{I_{F}}\right) T$$

$$V_{n1} = -\frac{KT}{q} \left(\ln T^{r}\right)$$

这就是 PN 结正向压降作为电流和温度函数的表达式,它是 PN 结温度传感器的基本方程。

令I_F=常数,则正向压降只随温度而变化

在恒流供电条件下,PN结的 V_F 对T的依赖关系取决于线性项 V_1 ,即正向压降几乎随温度升高而线性下降,这就是PN结测温的依据。

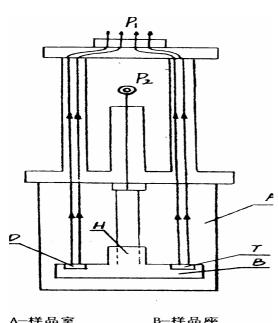
 V_F 一T的特性还随PN结的材料而异。

略去非线性项,可得

$$V_g = V_F(0) + \frac{V_F(0)}{T} \Delta T = V_F(273.2) + S \cdot \Delta T$$

ΔT=-273.2°K,即摄氏温标与凯尔文温标之差。

实验装置如图:



A-样品室 D-待测 PN 结 P₁--D、T 引线座 P₂--加热电源插孔 B-样品座 T-测温元件 H-加热器

实验数据:

实验起始温度T_S= 26.6 ℃

工作电流 I_F= 50 μA

起始温度为 T_S 时的正向压降 V_F (T_S) = 590 mV

(升温过程数据)

控温电流 A	$\Delta V = V_F (T) - V_F (T_S)$	$T\mathbb{C}$	T=(273.2+T)°K
	mv		
0.2	-10	30.9	304.1
0.2	-20	35.2	308.4
0.2	-30	39.6	312.8
0.3	-40	44.1	317.3
0.3	-50	48.6	321.8
0.3	-60	53.1	326.3
0.3	-70	57.3	330.5
0.3	-80	61.7	334.9
0.4	-90	66.5	339.7
0.4	-100	70.9	344.1
0.5	-110	75.4	348.6
0.5	-120	79.8	353.0
0.5	-130	84.3	357.5
0.5	-140	88.8	362.0
0.6	-150	93.3	366.5

0.6	-160	97.7	370.9
0.6	-170	102.0	375.2
0.7	-180	106.6	379.8

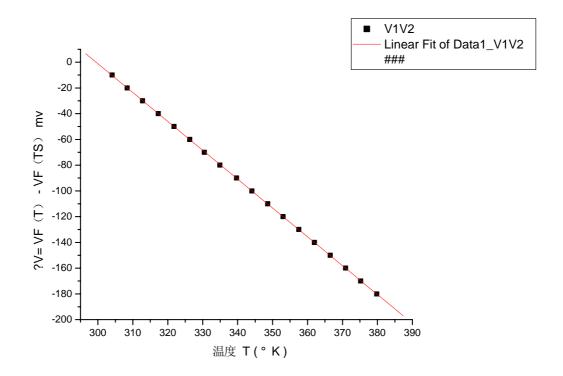
(降温过程数据)

$\Delta V = V_F (T) - V_F (T_S) \text{ mv}$	T℃	T=(273.2+T)°K
-10	30.4	303.6
-10	30.4	303.0
-20	34.8	308.0
-30	39.6	312.8
-40	44.5	317.7
-50	48.9	322.1
-60	53.5	326.7
-70	57.8	331.0
-80	62.8	336.0
-90	67.5	340.7
-100	71.5	344.7
-110	76.5	349.7
-120	80.7	353.9
-130	84.9	358.1
-140	89.4	362.6
-150	94.5	367.7
-160	98.5	371.7

-170	103.2	376.4
-180	107.4	380.6

数据处理:

- 求被测 PN 结正向压降随温度变化的灵敏度 S(mv/℃)。 作ΔV—T 曲线(使用 Origin 软件工具),其斜率就是 S。 (pn1 开氏温度表示)
 - (1) 升温过程:

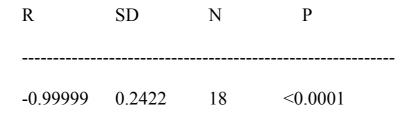


对升温过程数据进行线性拟合的结果如下:

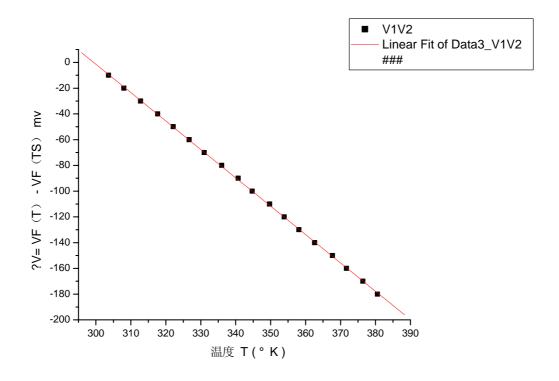
Linear Regression for Dataup V1-V2:

$$Y = A + B * X$$

Parameter	Value	Error
A	671.14769	0.84496
В	-2.24114	0.00247



(2) 降温过程



对降温过程数据进行线性拟合的结果如下:

Linear Regression for Datadown_V1V2:

$$Y = A + B * X$$

Parameter	Value	Error
Α	659.97597	2.24997
В	-2.20467	0.00655

R SD N P

-0.99993 0.65439 18 <0.0001

灵敏度 S 取两组数据处理中的 B 的平均值:

$$S=[(-2.24)+(-2.20)]/2=-2.22$$
 (mv/°C)

?

2. 估算被测PN结材料硅的禁带宽度 $E_g(0)$ =q $V_g(0)$ 电子伏。

根据(6)式,略去非线性项,(ΔT =-273.2°K,即摄氏温标与凯尔文温标之差)可得:

$$V_g = V_F(0) + \frac{V_F(0)}{T} \Delta T = V_F(273.2) + S \cdot \Delta T$$
 (*)
$$= 590 \quad \text{mV} + (-2.22) \quad (\text{mv/°C}) (-273.2-26.6) \text{°K}$$

$$= 1255.56 \text{ mV}$$

$$= 1.26 \text{ V}$$

$$E_g(0) = qV_g(0) = 1.26 \text{ 电子伏}$$

3. 将实验所得的 E_g (0) 与公认值 E_g (0) =1.21 电子伏比较,求其误差得:

[|1.20-1.21|/1.21]*100% = 4.1%

思考题

1. $测V_F(0)$ 或 $V_F(T_R)$ 的目的何在?为什么实验要求测 ΔV —T曲线而不是 V_F —T曲线。

答:测 $V_F(0)$ 或 $V_F(T_R)$ 的目的在于满足(*)式计算,获得正向压降的数值。由实验原理部分的分析知,令 I_F =常数,在恒流供电条件下,PN结的 V_F 对T的依赖关系取决于线性项 V_1 ,即正向压降几乎随温度升高而线性下降。测 ΔV —T曲线,做线性拟合更精确。

2. 测 ΔV 一T 曲线为何按 ΔV 的变化读取 T,而不是按自变量 T 取 ΔV 。

答:温度读书变化不易精确控制,按 ΔV 每改变 10mV 立即读取一组 ΔV 、T,这样可以减小测量误差。